

METHOD AND DEVICE FOR IMAGING TERAHERTZ

Publication number: JP8320254

Publication date: 1996-12-03

Inventor: MAACHIN SHII NASU

Applicant: AT & T CORP

Classification:

- International: G01J3/28; G01N21/17; G01N21/27; G01N21/35; G01N21/49; G01R31/308; G01J3/28; G01N21/17; G01N21/25; G01N21/31; G01N21/47; G01R31/28; (IPC1-7): G01J3/28; G01N21/17

- European: G01N21/35F; G01N21/49

Application number: JP19960027183 19960215

Priority number(s): US19950388933 19950215

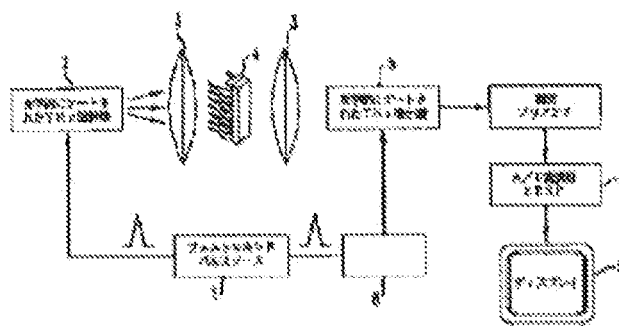
Also published as:

EP0727671 (A2)
US5710430 (A1)
US5623145 (A1)
EP0727671 (A3)
EP0727671 (B1)

[Report a data error here](#)

Abstract of JP8320254

PROBLEM TO BE SOLVED: To discriminate between different materials and environments by collecting transmission signals propagating through an object and processing the information contained in these signals for each point or 'pixel' on the object thereby analyzing the frequency dependency in time region. **SOLUTION:** An object 4 is set in the focal plane of a tera hertz (THz) beam and scanned in x and y directions in a zigzag pattern using a motor driven orthogonal conversion stage. A scan delay section 6 varies the delay of pulse between an optically gated THz transmitter 2 and a gated detector 5. A photocurrent generated from the detector 5 is fed through a preamplifier to an A/D converter and a DSP 7. An A/D converter for converting the speed and a DSP processor for Fourier transforming the waveform are employed. An FFT spectrum is represented by colored dots on the screen of a display 8 and the frequency components of THz are represented as a visible spectrum.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

Family list12 family members for: **JP8320254**

Derived from 8 applications

[Back to JP832](#)

- 1 Method and apparatus for terahertz imaging**
Inventor: NUSS MARTIN C (US) **Applicant:** AT & T CORP (US)
EC: G01N21/35F; G01N21/49 **IPC:** **G01J3/28; G01N21/17; G01N21/27** (+11)
Publication info: **DE69630065D D1** - 2003-10-30
- 2 Method and apparatus for terahertz imaging**
Inventor: NUSS MARTIN C (US) **Applicant:** AT & T CORP (US)
EC: G01N21/35F; G01N21/49 **IPC:** **G01J3/28; G01N21/17; G01N21/27** (+11)
Publication info: **DE69630065T T2** - 2004-07-08
- 3 Method and apparatus for terahertz imaging**
Inventor: NUSS MARTIN C (US) **Applicant:** AT & T CORP (US)
EC: G01N21/35F; G01N21/49 **IPC:** **G01J3/28; G01N21/17; G01N21/27** (+11)
Publication info: **EP0727671 A2** - 1996-08-21
EP0727671 A3 - 1997-03-05
EP0727671 B1 - 2003-09-24
- 4 Method and apparatus for terahertz imaging**
Inventor: NUSS MARTIN C (US) **Applicant:** LUCENT TECHNOLOGIES INC (US)
EC: G01N21/35F; G01N21/49 **IPC:** **G01N21/27; G01N21/35; G01N21/49** (+5)
Publication info: **EP0828162 A2** - 1998-03-11
EP0828162 A3 - 1998-08-19
- 5 METHOD AND DEVICE FOR IMAGING TERAHERTZ**
Inventor: MAACHIN SHII NASU **Applicant:** AT & T CORP
EC: G01N21/35F; G01N21/49 **IPC:** **G01J3/28; G01N21/17; G01N21/27** (+11)
Publication info: **JP3387721B2 B2** - 2003-03-17
JP8320254 A - 1996-12-03
- 6 METHOD AND APPARATUS FOR INSPECTION OF PRODUCT**
Inventor: NUSS MARTIN C **Applicant:** LUCENT TECHNOLOGIES INC
EC: G01N21/35F; G01N21/49 **IPC:** **G01N21/27; G01N21/35; G01N21/49** (+5)
Publication info: **JP10090174 A** - 1998-04-10
- 7 Method and apparatus for terahertz imaging**
Inventor: NUSS MARTIN C (US) **Applicant:** LUCENT TECHNOLOGIES INC (US)
EC: G01N21/35F; G01N21/49 **IPC:** **G01J3/28; G01N21/17; G01N21/27** (+11)
Publication info: **US5623145 A** - 1997-04-22
- 8 Method and apparatus for terahertz imaging**
Inventor: NUSS MARTIN C (US) **Applicant:** LUCENT TECHNOLOGIES INC (US)
EC: G01N21/35F; G01N21/49 **IPC:** **G01J3/28; G01N21/17; G01N21/27** (+11)
Publication info: **US5710430 A** - 1998-01-20

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-320254

(43)公開日 平成8年(1996)12月3日

(51) Int.Cl. ^a	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 1 J 3/28			G 0 1 J 3/28	
G 0 1 N 21/17			G 0 1 N 21/17	Z

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平8-27183

(22)出願日 平成8年(1996)2月15日

(31)優先権主張番号 08/388933

(32)優先日 1995年2月15日

(33)優先権主張国 米国 (US)

(71)出願人 595119464

エイ・ティ・アンド・ティ・アイピーエ

ム・コーポレーション

アメリカ合衆国、33134 フロリダ、コーラルゲーブルズ、ボンズドレオンブルヴァード 2333

(72)発明者 マーチン シー, ナス

アメリカ合衆国 07704 ニュージャーシ
ィ, フェア ヘヴン, リンカーン アヴェ
ニュー 146

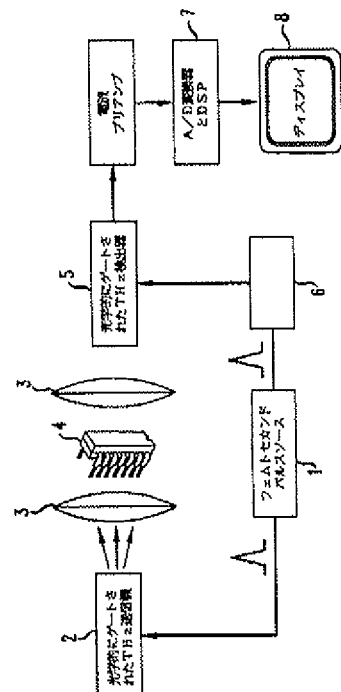
(74)代理人 弁理士 岡部 正夫 (外10名)

(54)【発明の名称】 テラヘルツのイメージ化の方法と装置

(57) 【要約】

【課題】 テラヘルツの周波数レンジ内での信号により物体のイメージを生成する方法と装置を提供する。

【解決手段】 特定の材料および物体は、材料または物体を通過し照明する信号中のテラヘルツ遷移の周波数依存の吸収、分散、および反射によりにより特徴付けすることができる。本発明のテラヘルツイメージ化システムは、物体を通過して伝播した送信信号を集め、次いでこれらの信号中に含まれた情報を物体上の各点または「ピクセル」に対して処理することで時間領域内の周波数依存を分析する。これは、異なる材料、化学構造、あるいは環境間を区別できる、非侵略的なイメージ化技術である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 物体イメージ化する方法であって、
前記物体上の特定のポイントにおいて高速度パルスのシーケンスを送信するステップ、
前記物体を通る伝播の後に前記信号を検知するステップ、
前記信号が前記物体上の複数の空間的に別個の領域を通過するように前記物体を変換するステップ、及び前記物体のイメージを生成するために受信した信号中に含まれている時間領域内のスペクトル情報を分析するステップを含む物体をイメージ化する方法。

【請求項2】 前記分析するステップが特定のポイントにおける物体の構成特性を識別することを含む請求項1記載の方法。

【請求項3】 前記信号が100GHzから20THzの周波数レンジ内である請求項2記載の方法。

【請求項4】 物体をイメージ化するための装置であって、

高速度パルス信号のソース、

前記信号が前記物体の特定の領域上に焦点されるようにするためのイメージ化光学手段、

前記物体を通る伝播の後の前記信号を受信するための検出器、

前記信号が前記物体上の複数の空間的に別個の領域を通過するように前記物体を変換するための手段、および前記物体のイメージを生成するために受信した信号中に含まれている時間領域内のスペクトル情報を分析するための前記検出器に接続された手段を含む物体をイメージ化するための装置。

【請求項5】 前記分析するための手段が特定のポイントにおいて物体の構成特性を識別するための手段をさらに含む請求項4記載の装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、テラヘルツの周波数レンジにおける分光法に関し、より詳しくは、この周波数レンジ内での信号で物体のイメージを生成するための方法と装置に関するものである。

【0002】

【発明が解決しようとする課題】テラヘルツの時間領域の分光法 (THz-TDS) は遠赤外線スペクトル領域における非常に強力な分光法上の技術である。テラヘルツの放射は、P. Smithなどの、IEEE J of Quantum Electronics, Vol. 24, No. 2, 第255-260頁 (1988)、およびN. Katzenellenbogenなどの、Appl. Phys. Lett., Vol. 58, No. 3, 第222-224頁 (1991) に記載された光伝導性のダイポールアンテナのような、光学的にゲートされた送信機および受信機を使用して発生および

び検知される。これらの技術によれば、テラヘルツの分光法は、合理的に良好な信号対ノイズ比 (約 10^4 まで) を提供し、また冷却された検出器のような特別に熱的に安定な装置なしに実施することができ、コンパクトなシステムを実現でき、また集積回路技術と互換性のある送信機と検出器を提供するものである。

【0003】テラヘルツ時間領域分光法を使用した多くの研究が固体、液体、およびガス上で実施されている。いくつかの研究においては、半導体および超電導体においてキャリアにより影響されるテラヘルツ信号のスペクトルを分析されている。他の研究においては、水蒸気およびN₂Oガス上での時間領域分光法が実施されている。その他の研究においては、液相において化学化合物のテラヘルツ時間領域分光法が報告されている。これらの全ての研究においては、その均質な領域に関するスペクトル情報を提供するために、テラヘルツ信号は単一の照明された体積領域 (通常は直径2.5mm) において検査対象の物質を通してテラヘルツ信号が送信される。

【0004】

【課題を解決するための手段】本発明者は、時間領域分光法および、より詳しくは、テラヘルツ信号は、物体上の別個の (空間的に分離された) ポイントを通して伝播する個々の信号を集めまたこれらの信号を処理して物体のイメージを生成することによる、物体をイメージ化するために使用することができることを見出した。別個のポイントにおいて物体上の信号源に焦点し、また伝播方向を横断するパターンで物体を同時横断でソースと検出器を走査することも可能である。さらに、ソースが全体の物体を実質的に平行なビームで覆うようにして、次いで物体を走査する検出器によりサンプリングさせることも可能である。当然のことであるが、他の実施の形態においては、焦点された送信機と受信機を実質的に固定された位置において保持しながら、略横断する方向で物体を変換 (translate) することも可能である。

【0005】

【発明の実施の形態】以下に、添付図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。本発明による図1のTHzイメージ化システムは、繰り返しの、フェムト秒カドの持続時間の、光パルスのソース1、広いスペクトル帯域幅を有する光学的にゲートされたTHz遷移の送信機2、レンズおよび/または鏡からなるイメージ化光学系3、調査されるべき物体4、時間ゲートされた検出器あるいは検出器アレイ5、THz周波数の遷移を音響的な(Hz)レンジまで一時的にヘテロダインしてこれらを電子技術により処理できるようにするために送信機上と検出器上との間のフェムト秒でゲートするパルスの間の遅延を数Hzから数百Hzの速度で変化させることができる走査遅延部6、時間領域データを処理して所望の情報を抽出するためにデジタル信号プロセッサとA/D

変換器を含むデジタル信号処理ユニット7、並びにイメージを見るためのディスプレイ8を含んでいる。

【0006】特定の材料と物体は、材料または物体を通してテラヘルツ遷移の周波数依存性の吸収、分散、および反射により特徴付けすることができる。本発明のテラヘルツイメージ化システムは、物体を通して電波する送信信号を集め、次いでこれらの信号中に含まれた情報をその物体上の各ポイントまたは「ピクセル」に対して処理することにより、時間領域においてこの周波数依存性を分析する。これは、異なる材料、化学構造、あるいは環境 (environment) 間を区別できる、非侵略的なイメージ化技術である。この技術は、生体組織の生化学的なイメージ化、「安全なX線」、化学反応分析、環境上および汚染上の制御、材料検査、欠陥検出、半導体ウェハ内のドーピングの非接触性のマッピング、レーザ結晶内のドーピングと欠陥のプロフィール化、および包装検査などに限定されない用途を有している。

【0007】典型的なテラヘルツ送信機は、620nmの回りで動作するモードロックされた色素レーザあるいは800nmの回りで動作するモードロックされたTi:サファイアないしCr:LiSAFレーザのいずれかからの100fsのレーザパルスにより照明された後に1THzに集中された電磁放射の単一のサイクルを放出する。テラヘルツ遷移の持続期間が短いために、スペクトルは広帯域であり、典型的には100GHz以下から数THzまで延在している。

【0008】この時点では、THz帯域幅の電気信号の測定および処理をすることができる電子回路はない。光学およびTHzパルスの繰り返し特性 (典型的には~100MHz繰り返し速度) に基づくサンプリング技術は、サンプリングウィンドウが測定されるべきいずれかのTHz遷移よりも短い場合においてTHz波形を測定するために使用できる。典型的な光伝導サンプリングゲートは0.5psより短いサンプリング時間を有し、またよって、2THz以上の周波数遷移を測定することができる。サンプリング技術においては速い電子回路は必要なく、また大ボールアンテナ内の平均の光電流だけが計測される。サンプリング範囲と同様に、THz波形と検出器のゲートパルスの間の遅延は約10-100Hzの速度でゆっくりと走査される。よって、各サンプリングのパルスは、サンプルから全体のTHz波形が再構築されるまでTHzパルスをいくらか異なる時間においてサンプリングする。これにより、THz波形のkHzレンジへの「一時的な変換」がなされて、電子回路による処理が容易となる。このようなサンプリング技術は、等価時間サンプリング (Equivalent-Time-Sampling) として知られているが、通常のデジタルサンプリングのオシロスコープを使用しても良い。この等時性のサンプリング技術は、ピコ秒の光学的

サンプリングに対してK. WeingartenなどによりIEEE J of Quantum Electronics, Vol. 24, No. 2, 第198~220頁 (1988において) 説明されている。

【0009】ほとんどではないが、多くの化合物はこれらTHz遷移によりカバーされる周波数範囲内で非常に強い周波数依存性の吸収または反射を示す。同様に、分子および化学化合物は、少なくともガス相において、また特定の結晶ではイオンにおいても、THzスペクトル領域における強力なシャープな吸収ラインを有する。吸収ラインは、水分子のような検査中の材料や環境の特性であり、また分子の「指紋」として機能する。各化学物質はよって、そのサンプルの化学組成および環境を識別する特徴的なTHz波形を有する。完全に不透明な材料あるいは高電気導電性の材料もある。

【0010】本発明のTHzイメージ化システムにおいては、上記したスペクトルを計算ないし直接計測する必要がない。その代わり、会話認識および処理と類似した方法で、関連する情報が時間領域データから直ちに抽出することができる。図2と図3は入力THz波形 (ダッシュされた) とドーブされたシリコンサンプル (図2) および水蒸気 (図3) を通る伝播後の波形である。

【0011】デジタル信号プロセッサは、THzビームにより照明されたスポットにおける特定の材料を決定するために、送信されたTHz波形 (シリコンに対しては特定の波形と変化および減衰、水蒸気の場合には特徴的な周波数のリングング (ringing)) の特徴的な形状を認識することができる。これは、前もってDSPにこれらの特別な波形をトレーニング (あるいはロード) する必要がある。このような工程は当業者には自明であり、省略する。

【0012】図1の送信機、受信機、および光学系に対する図4に示した特別な実施の形態では、送信機からのTHzビームは0.3-0.5mmの拡散制限されたスポットに焦点される。これは1THz放射に対する拡散制限されたスポットサイズである、またこの技術で可能な最良の空間的な分解に近いものである。このスポットは次いで単一のTHz検出器上でイメージ化される。サンプルはTHzビームの焦平面内に位置され、また2つの直交する、モータ駆動の変換ステージを使用したジグザグパターン内のxとy内で走査される (xとyの矢印により絵で示した)。

【0013】送信機と検出器のゲートしたパルスの間の遅延は、10Hz走査遅延ラインにより連続的に走査される。走査ラインの振幅は調節することができ、またデータ獲得の時間ウィンドウを決定する1mmの振幅は、6.9psの時間ウィンドウに対応する。光伝導のダイポール検出器内で発生する平均の光電流は電流-電圧変換器により計測され、また次いでA/D変換器とDSPプロセッサカードに供給される。ここで、A/D変換器

としては50kHz変換速度ができるものを、またDSPプロセッサとしては各秒において100FFTの速度で波形をフーリエ変換できるものを、それぞれ使用した。よって、このシステムによれば、各THz波形のFFTスペクトルを10Hz走査速度に同期して容易に得ることができる。

【0014】この実施した例において、FFTスペクトルはディスプレイのスクリーン上に色付けされたドットとして表現され、THzスペクトルの周波数成分は視覚可能な(紅色の)スペクトルとして表現される。つまり、テラヘルツスペクトルは視覚可能なスペクトル上にマッピングされ、検査中の物体を通して伝播した周波数成分だけが表示された色に寄与するようになる。

【0015】DSPがこのシステムにおいて使用されているので、受信したテラヘルツ信号と特定の要素、化合物などに関連している蓄積されたパターンの間のたたみ込み(相関)を計算することにより時間領域技術を利用することも可能である。受信した信号に最も近く合致した信号が走査された物体のポイントを識別するものである。

【0016】実験による他の例においては、DSPプロセッサは特定の分子の特性である特定の吸収ラインを探し、この吸収パターンに特定の色と強度を割り当てる。各走査の後、サンプルは1つの「ピクセル」だけ移動され(好ましくは)、また表示はこの特定のピクセルに対して更新される。上記のシステムでは、50×50にイメージが獲得され、また丁度4分にわたって表示される。

【0017】図8は、上記で得られたTHzイメージに対する予備的な結果を示したものである。

【0018】図1のイメージ化システムの送信機、受信機、および光学系に対する図5に示した他の実施の形態においては、サンプルは静止したままであり、またTHzビームはサンプルを横切って走査される。これは、鏡によりTHzビームを機械的に操舵することにより、またはTHzビームを光学的に操舵すること(この場合、光学ビームの操舵がTHzビームの操舵となる)により行うことができる。

【0019】図1のイメージ化システムの送信機、受信機、および光学系に対する図6に示した実施の形態においては、図7に示された焦平面THz検出器アレイを使用して、全体のサンプルに対するTHz波形が同時に獲得される。よって、全体のサンプルはTHzビームにより投光照明され、またサンプルはレンズシステムを使用して焦平面検出器アレイ上にイメージ化される。投光照明によって照明が個々のポイントのソースからの平行ビームとして現れる。

【0020】焦平面THz検出器アレイは、ゲートする時間がピコ秒以下となるように低温度(LT)GaAsまたは照射損傷されたサファイア上のシリコン(Si1

icon-on-Sapphire; SOS)上でリソグラフィ的に規定された、THzダイポールアンテナ(この場合には各側上で50μm)の2次元的なアレイから構成される。組み合わせられたフィンガー接点を使用したMSM光伝導性のスイッチがアンテナチップの間に規定される。組み合わせられた光伝導性のMSMスイッチのサイズは大体10μm方形である。各アンテナ/MSM要素はTHzイメージピクセルを構成する。MSM光伝導性スイッチは、チップの全体の領域を被覆するビームからの短い光学パルスによりゲートされ、またマイクロレンズアレイを使用したMSM検出器上に焦点される。マイクロレンズアレイとゲートパルスは、THz放射(ビームスプリッタを備えた)と同じ側、あるいは反対側(この場合、THzビームはそれがアンテナにより検出される前にチップ基板を通して移動する)から来る。読み出されたエネルギーの1pJだけが各MSMゲートに対して必要であり、これにより10nJ光パルスが100×100の焦平面アレイをゲートすることができる。アンテナチップは、検出された光電流をチップを保持する各アンテナパッド上で1つの接点が下側において他のチップと、またDSPプロセッサと、半田バンプ接続(solder bump-bond)される。好ましくは、下側の半田バンプにより接触したチップはCCDアレイであり、これによりビデオカメラのように全てのピクセルは順次読み出すことができる。光発生された電荷は、多くの光パルスにおいて、電荷が読み出される前に、CCDアレイ内で蓄積される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理による例示的なテラヘルツイメージ化システムの簡略化されたブロック図である。

【図2】既知の材料を通る伝播後における入力テラヘルツ波形と出力波形の間の比較の説明図である。

【図3】既知の材料を通る伝播後における入力テラヘルツ波形と出力波形の間の比較の説明図である。

【図4】図1のシステムにより走査されるべき物体に対する所望量の走査を保証するための例示的な実施の形態の説明図である。

【図5】図1のシステムにより走査されるべき物体に対する所望量の走査を保証するための例示的な実施の形態の説明図である。

【図6】図1のシステムにより走査されるべき物体に対する所望量の走査を保証するための例示的な実施の形態の説明図である。

【図7】図6の実施の形態において有用な例示的なテラヘルツ焦平面アレイの一部の説明図である。

【図8】例示したテラヘルツイメージ化システムにより生成された半導体デュアルインラインパッケージ化されたチップのイメージを示した説明図である。

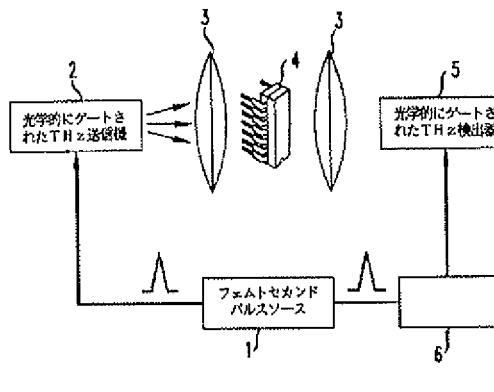
【符号の説明】

1 ソース

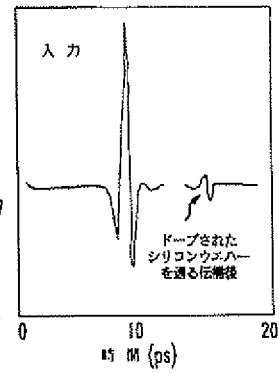
- 2 送信機
3 光学系

- 6 走査遅延部
7 デジタル信号処理ユニット

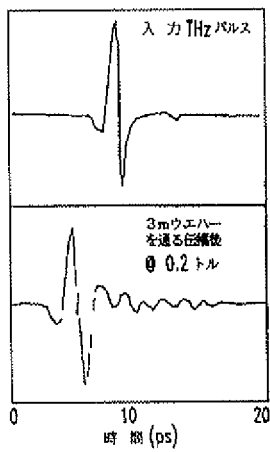
【図1】



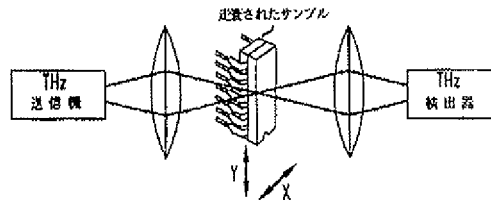
【図2】



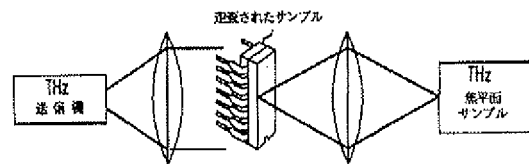
【図3】



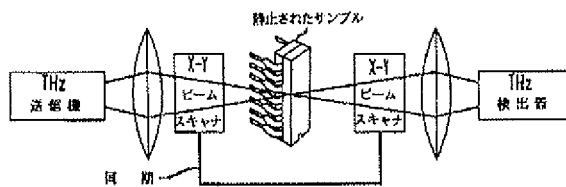
【図4】



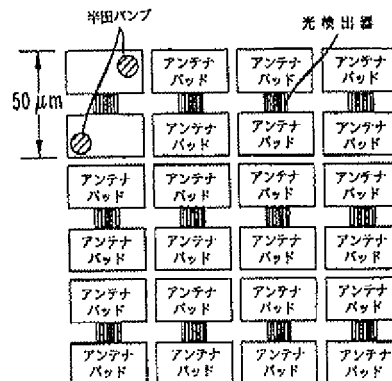
【図6】



【図5】



【図7】



(6)

特開平8-320254

【図8】

